

thermo scientific

Nicolet RaptIR

FTIR 显微镜



用户手册

269-3517 01

修订版 A

九月 2022

ThermoFisher
SCIENTIFIC

目录

1. 简介	4
1.1 预期用途	5
1.2 免责声明	6
1.3 使用的约定	7
1.4 保修信息	8
2. 概述	9
2.1 特点和控件	10
2.2 连接和端口	12
2.3 选配的操纵杆	13
2.4 选配的三筒目镜	14
2.5 使用 OMNIC Paradigm 软件	15
3. 操作	18
3.1 准备显微镜	19
3.2 分析样品	22
3.3 ATR 测量	29
3.4 定位、照亮和遮盖样品	31
3.5 验证显微镜性能	36
3.6 使用偏振器	38
4. 维护	42
4.1 清洁显微镜	43
4.2 维护液氮杜瓦瓶	44
5. 故障排除	45
6. 联系我们	48
6.1 订购部件	49

© 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。

Microsoft、Windows 和 Excel 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Teflon 是 Chemours 在美国和/或其它国家(地区)的商标。所有其他商标均为 Thermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的财产。

如需技术支持, 请联系: www.thermofisher.com

Thermo Fisher Scientific Inc. 向购买产品的客户提供本文档, 用作产品操作指南。本文档受版权保护, 未经 Thermo Fisher Scientific Inc. 书面许可, 严禁复制本文档或本文档中的任何部分。

本文档的内容可能随时更改, 恕不另行通知。本文档中的所有技术信息仅供参考。本文档中的系统配置和规格将取代购买者先前获得的所有信息。

Thermo Fisher Scientific Inc. 不保证本文档的完整性和准确性, 而且对于可能因使用本文档(即使是在正确遵循本文档中的说明信息的情况下)而导致的任何错误、疏忽、损害或损失, Thermo Fisher Scientific Inc. 概不负责。

本文档不属于 Thermo Fisher Scientific Inc. 和购买者之间的销售合同的一部分。本文档不应以任何方式约束或修改任何“销售条款和条件”, 若两份文档信息发生冲突, 则以“销售条款与条件”中的信息为准。

仅供研究使用。此仪器或附件不是医疗器械, 因此不适合用于预防、诊断、护理或治疗疾病。

警告



避免爆炸或火灾的发生。

此仪器或附件不适合在爆炸性环境区域中使用。

1. 简介

1.1 预期用途

Thermo Scientific Nicolet RaptIR FTIR 显微镜是一款傅立叶变换式 (FTIR) 显微镜, 设计用于受控实验室环境, 旨在与 Nicolet 系列光谱仪搭配使用。

使用 RaptIR 显微镜, 您可以快速找到目标、采集高分辨率视觉图像, 以及生成高空间分辨率 IR 数据进行分析。

OMNIC Paradigm 软件包括一整套分析工具、可自定义的工作流用于自动化您的日常任务, 简单易用的工具用于颗粒分析以及区域、点和线分析。

使用 RaptIR 显微镜, 您可以对厚(最大 4 厘米)和重(最大 5 公斤)样品进行采样, 此外, 该显微镜还配有多个物镜和一个自动物镜转换器, 可支持一系列选项, 包括查看样品和采集 IR 数据。

1.2 免责声明

请勿将显微镜用于本用户手册所述预期用途以外的任何用途。

注意

使用显微镜前, 请阅读您系统的《场地及安全指南》。

1.3 使用的约定

安全防范措施和其他重要信息使用以下格式：

危险



避免危险。表示如果未能避免将会导致严重人身伤害或死亡的危险情况。

警告



避免危险。表示如果未能避免可能会导致严重人身伤害或死亡的危险情况。

注意事项



避免危险。表示如果未能避免可能导致轻度或中度人身伤害的危险情况。

注意

遵循此标签的指示以防止损坏系统硬件或丢失数据。

Note 包含有帮助的补充信息。

1.4 保修信息

Thermo Fisher Scientific 保证我们销售每个产品在工料方面均不存在任何缺陷, 且符合该产品用户说明文件中规定的产品规范。若该产品在其保修期内未能如我们所保证的那样正常运行, 我们将免费提供维修或更换服务。若据我们判断我们无法提供上述服务, 您可以将产品退回, 我们将退还您购买该产品所支付的费用。

此保修可取代所有其他明示或默示保修, 包括对特定用途的适销性和适用性以及 Thermo Fisher Scientific 应承担的任何其他责任或义务(无论是否以合同、保修、口头或其他方式约定)的默示担保。Thermo Fisher Scientific 对所有间接性、偶发性和意外损失不承担并拒绝承担任何责任。

1.4.1 保修期

在美国和加拿大, 系统保修期为 12 个月。保修期从安装之日或发票日期起 30 天开始, 以较早者为准。

销往美国和加拿大境外的系统的保修期为自安装之日起 12 个月, 或自发货之日起 14 个月, 以较早者为准。

1.4.2 有限保修

滥用、事故、改装、不当的自然或操作环境、不当维护该产品或因不在我们责任范围之列的产品所导致的产品损坏, 均会造成该保修失效。

耗材不在保修范围内。

保修未涵盖的项目

我们不能保证产品会持续不间断或无故障运行。我们提供的特定非 Thermo Fisher Scientific 产品均以“保持原样”为基础。非 Thermo Fisher Scientific 产品制造商或供应商可能会提供其相应产品保修。软件用户文档提供了一份个别的软件保修。

注意

在装运箱内, 使用塑料袋将仪器密封以保持光学部件干燥。

打开塑料袋前, 必须静置 24 小时, 等待仪器的温度达到室温。如果在仪器达到室温之前打开塑料袋, 湿气将会在光学组件上冷凝并导致永久性损坏。

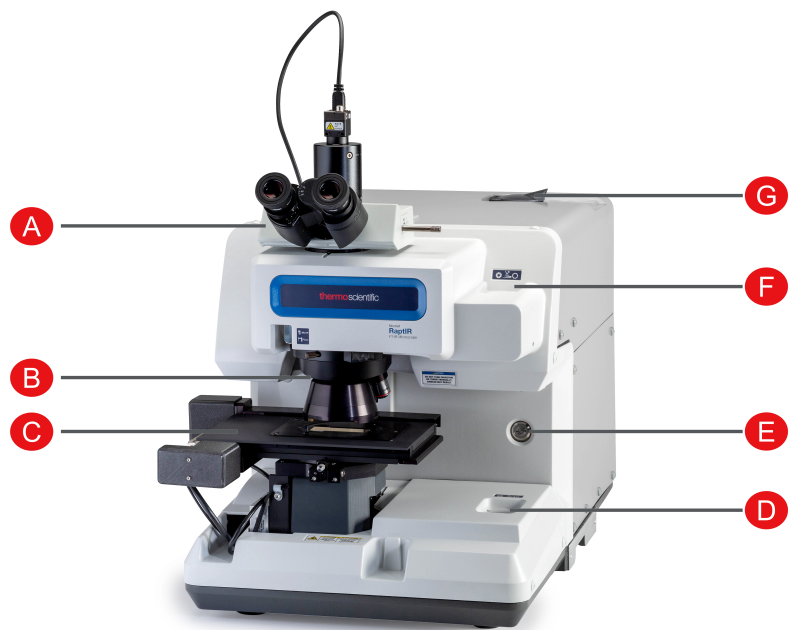
保修范围将不涵盖:

- 不正确搬运技术所导致的损坏。
- 在我们的服务工程师安装系统之前, 拆开装运箱所出现的缺少或损坏部件情况。
- 在仪器达到室温之前取下密封塑料袋所导致的损坏。

2. 概述

2.1 特点和控件

图2-1: 显微镜的主要特点



A	三筒视频目镜	选配的三筒目镜在 OMNIC Paradigm 软件中提供视觉和视频图像。单筒目镜(未显示)仅提供视频。
B	旋转物镜转盘	转盘支持 1 个红外物镜和 1 个视觉物镜。通常, 您将使用 15x IR 物镜和 4x 倍视觉物镜。显微镜还支持选配的 32x IR 物镜和 10x 或 40x 视觉物镜。
C	电动载物台	该载物台支持 40 mm 的工作距离, 和重达 5 kg 的样品。通过 OMNIC Paradigm 软件或选配的操纵杆控制载物台。切勿尝试用手移动载物台。
D	透视照明光圈	<p>使用视野光圈可调整照明视野的大小。它同心地打开和关闭。</p> <p>通常, 光圈将完全打开, 因此不在全视野范围内。如果样品表面不平整, 您可能会发现更容易对焦在光圈叶片的边缘以找到最佳对焦。</p>
E	电源指示灯和按钮	按下可打开或关闭显微镜电源。蓝色电源指示灯在显微镜启动时闪烁, 并在显微镜准备就绪使用时稳定亮起蓝灯。

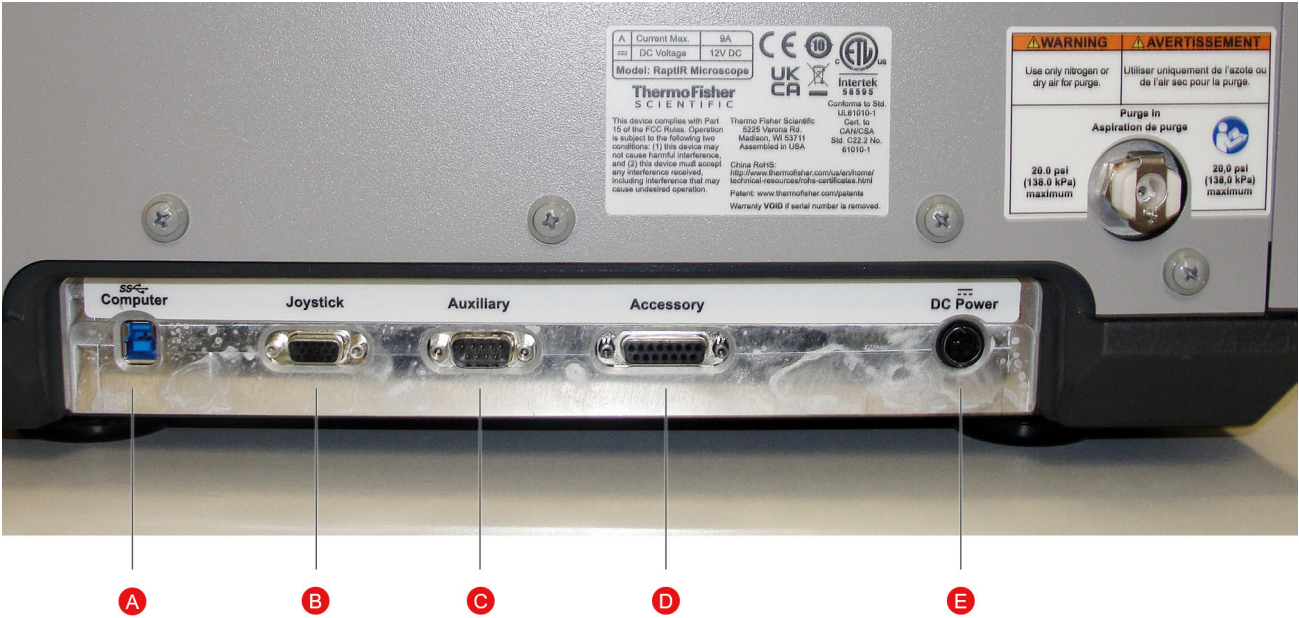
F	反射照明光圈	使用视野光圈可调整照明视野的大小。它相对于标线同心地打开和关闭。 通常, 光圈将完全打开, 因此不在全视野范围内。如果样品表面不平整, 您可能会发现如果首先部分关闭光圈并对焦在光圈叶片的边缘, 会更容易对焦目标区域。
G	1 升液氮杜瓦瓶	液氮杜瓦瓶可容纳 1 升液氮。冷却后, 检测器将保持冷却约 18 小时。详细信息, 请参阅 "冷却检测器" 。

图2-2: 载物台特写



A	ATR 传感器	ATR 传感器可检测是否安装了滑入式 ATR 附件。
B	样品载玻片对准指示符	将载物台上的红色指示点对准样品载玻片。
C	控制载物台方向	用于在安装过程中旋转载物台。安装后请勿调整。
D	滑入式 ATR 附件	选配的滑入式 ATR 附件用于 ATR 测量。

2.2 连接和端口



A USB 3.0 连接到计算机的 USB 3.0 端口

B 连接到选配的操纵杆

C 连接到光谱仪上的辅助信号端口

D 连接到光谱仪上的“附件”端口

E 连接电源线

2.3 选配的操纵杆

您可以使用选配的操纵杆来控制载物台位置和样品照明。载物台和照明也可以在软件中控制。

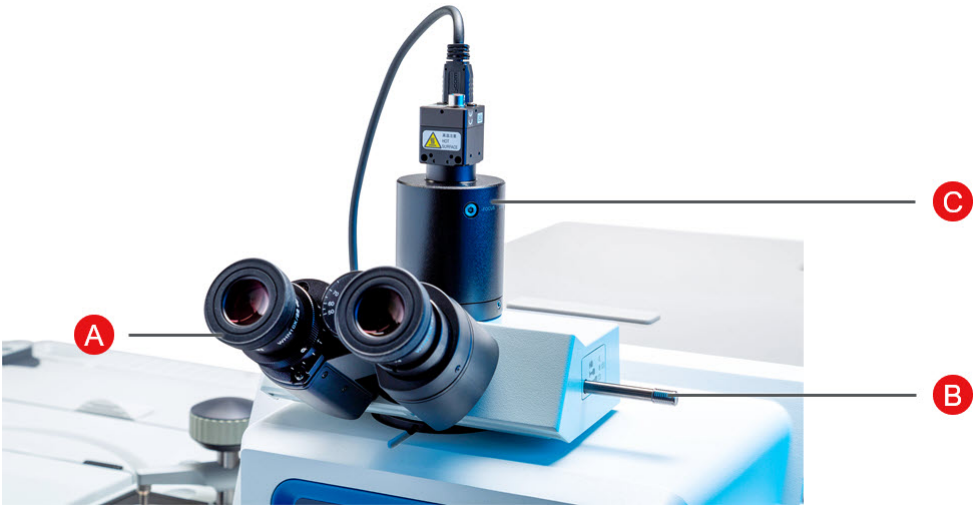
要连接操纵杆，请将数据线插入显微镜背面的“操纵杆”端口。



A	透过率照明控制	旋转可手动调暗或调亮透过率照明。
B	反射率照明控制	旋转可手动调暗或调亮反射率照明。
C	用于载物台控制的操纵杆	向前、向后、向左或向右推动操纵杆可沿样品平面移动载物台。 旋转可向上或向下移动载物台。
D	速度控制	控制载物台的速度以实现精确、缓慢移动或快速移动。

2.4 选配的三筒目镜

您的显微镜可能配有一个只有摄像机的单筒目镜，也可能配有一个带有摄像机和视觉目镜的三筒目镜。



A	视觉目镜	用于观察样品的可调目镜。最好与选配的操纵杆一起使用。
B	三位查看选择器	控制目镜的光路。 <ul style="list-style-type: none">• 进：只有目镜，没有摄像机• 中间：目镜和摄像机• 出：只有摄像机，没有目镜
C	摄像机	USB 摄像头使用 OMNIC Paradigm 软件进行操作。

2.5 使用 OMNIC Paradigm 软件

使用 Thermo Scientific 的简化材料分析软件 OMNIC Paradigm 软件运行您的显微镜并分析您的样品。用户友好的控制面板屏幕可帮助您查看仪器状态和最近的工作、处理光谱、进行多组分搜索以及新建谱库。该软件在设计时考虑了实验室经理和科学教育工作者，使用直观的拖放式 workflow 创建器帮助自动化 workflow。当您使用 Thermo Scientific OMNIC Anywhere 应用程序将 OMNIC Paradigm 数据上传到云端时，可以远程工作并与全球同事协作。

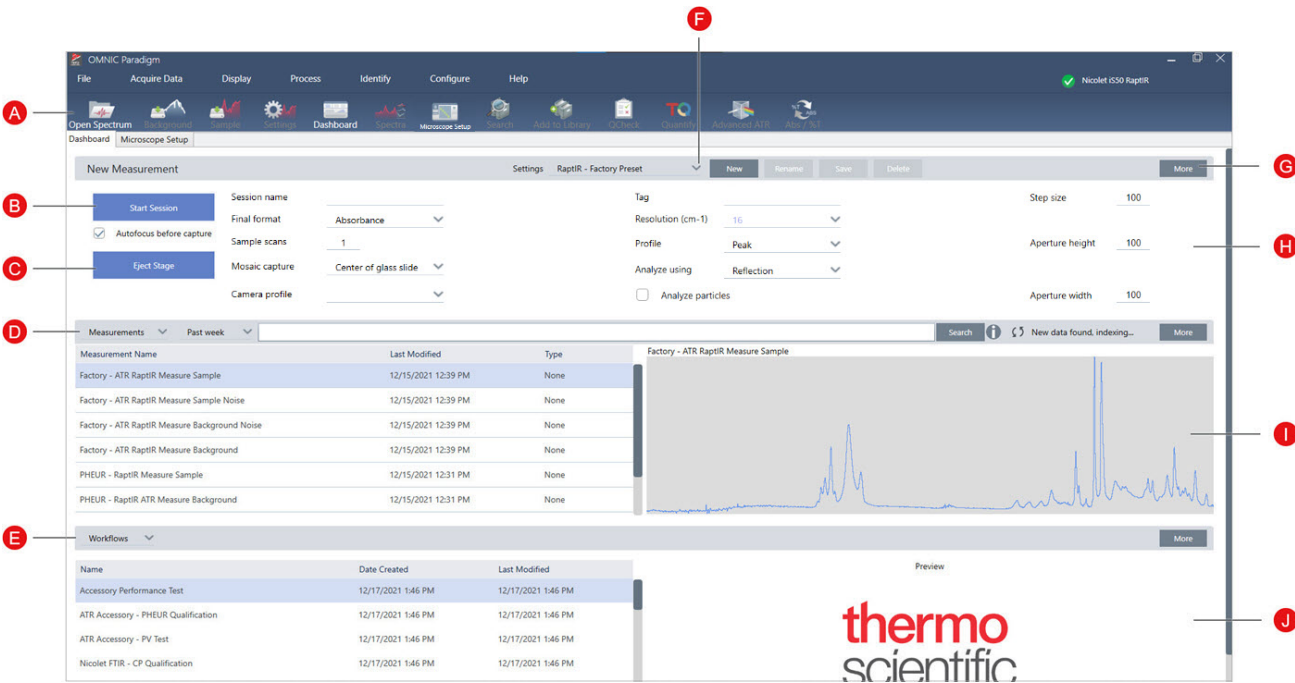
2.5.1 界面

在显微镜下工作时，您将主要在控制面板和工作阶段视图中工作。

控制面板

开始新工作阶段、编辑测量设置，查看最近的测量、报告和工作阶段，并在控制面板上查看 workflow。

图2-1: 显示显微镜工具的控制面板



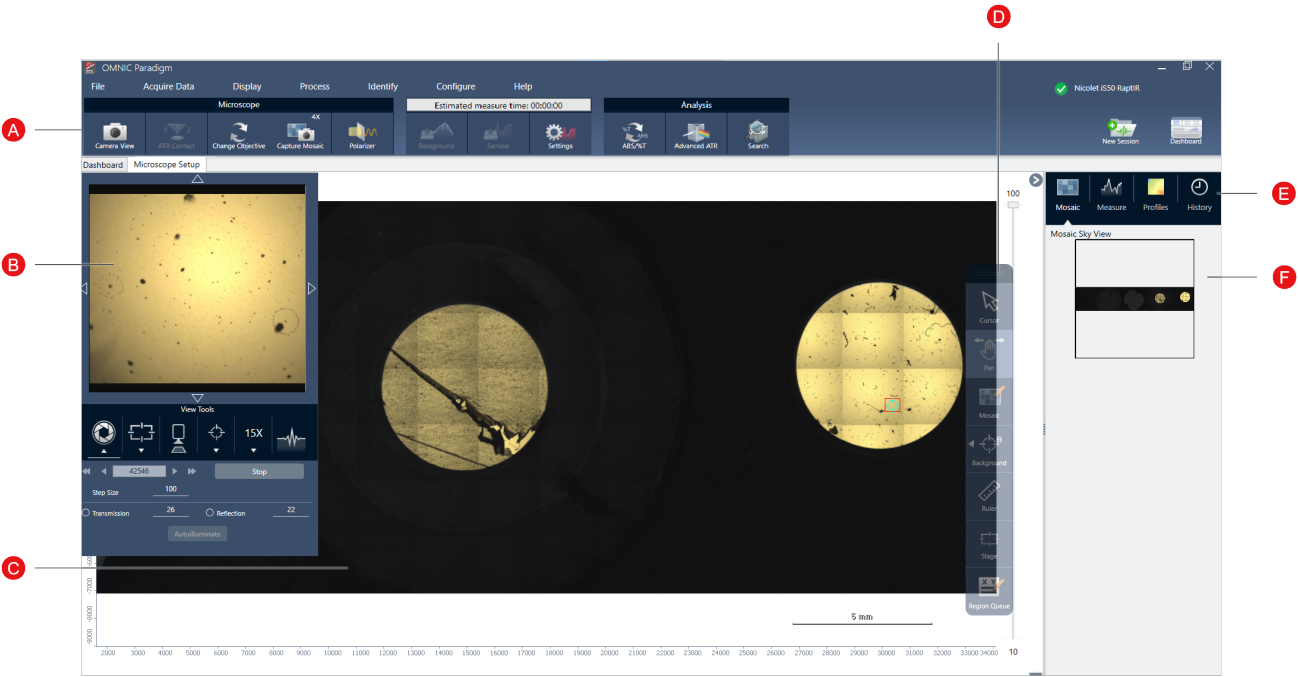
- | | | |
|----------|---------------|--|
| A | 工具栏 | 工具栏包括您需要经常使用的功能和工具的按钮，用于在控制面板、绘图和光谱视图之间导航。 |
| <hr/> | | |
| B | 开始工作阶段 | 上样并选择拼接图捕获位置后，单击 开始工作阶段 可切换到工作阶段视图并自动采集样品的拼接图像。选择 捕获前自动对焦 可以自动使样品最佳对焦。 |

C	弹出载物台	弹出载物台是可选操作。弹出会降低载物台并将其向前移动，让您有更多空间进行上样。上样后，单击“开始工作阶段”将载物台移回原位或手动移动。
D	测量、工作阶段和报告	显示您的测量、工作阶段和报告。从列表选择一个类别即可切换视图。
E	工作流和工作包	显示认证和性能验证工作流以及您的自定义工作流。有关创建和使用工作流的更多信息，请参阅 OMNIC Paradigm 软件指南和教程 。
F	设置	创建、选择、保存或删除设置集。
G	更多	单击“更多”可展开控制面板的任何主要部分并查看其他设置或详细信息。
H	采集设置	最常用的设置显示在此处的“新建测量”窗格中。单击“更多”可查看其他高级设置，包括背景测量设置。
I	预览	显示所选测量、绘图或报告的预览图像。
J	工作流或工作包预览	显示所选工作流或工作包的预览。锁定的工作流将显示一个徽标，而不是工作流的预览。

显微镜工作阶段视图

使用显微镜工作阶段可分析您的样品。在这里，您可以查看您的样品、定义您的目标分析区域并测量样品数据。

图2-2: OMNIC Paradigm 软件中的显微镜工作阶段视图



2. 概述

A	工具栏	查看其他显微镜设置并打开实时摄像机视图、捕获新的拼接图、测量光谱或导航回控制面板。
B	摄像机视图	<p>打开摄像机视图可查看样品的实时视觉图像。使用“查看工具”可调整照明、焦点和光阑, 以及快速拍摄拼接图快照、更改物镜或查看实时干涉图信号。</p> <p>使用实时图像周围的箭头可移动载物台, 无需使用操纵杆。</p>
C	拼接图视图	显示拼接图像, 也是您定义背景点和分析区域的主要工作区。
D	浮动工具栏	<p>用于与拼接图像交互的分析和导航工具。</p> <ul style="list-style-type: none">光标: 选择区域、点和光谱平移: 用于移动拼接图的可视部分拼接图: 用于绘制高放大率拼接图的区域分析工具<ul style="list-style-type: none">背景点: 选择要测量背景谱图的点区域: 绘制一个区域进行区域分析点: 选择一个点以测量光谱线: 测量线图颗粒分析: 绘制一个区域进行颗粒分析。此工具仅在控制面板上选择颗粒分析后可用。标尺: 使用标尺可测量拼接图视图中的对象载物台: 单击拼接图上的一个点可将载物台移动到该位置区域队列: 查看当前选择用于分析的所有区域和点。这些是单击“样品”时将测量的位置。
E	分析面板	在分析面板中查看拼接图、背景谱图、配置文件和历史记录。
F	拼接图俯视图	俯视图显示拼接图的高层视图。当您放大时, 俯视图将显示您正在查看的拼接图部分。您可以使用俯视图在整个拼接图中导航。

3. 操作

3.1 准备显微镜

要开始分析, 请冷却显微镜检测器, 打开系统, 然后启动 OMNIC Paradigm 软件。

3.1.1 冷却检测器

您的显微镜使用液氮冷却式检测器。使用显微镜之前, 请始终确保杜瓦瓶中有足够的液氮。

液氮杜瓦瓶可容纳 1 升液氮。如果按照以下程序冷却, 检测器应可保持冷却约 18 小时。

警告



避免冻烧。

液氮温度极低, 因此很危险。

- 穿戴防护服和护目镜, 并遵循标准实验室安全操作规范以防止受伤。
- 慢慢倒入液氮。如果倒得太快, 氮气可能会飞溅。

◆ 加注液氮杜瓦瓶

1. 打开杜瓦瓶盖, 并从杜瓦瓶中取出塑料塞。
2. 将漏斗插入检测器杜瓦瓶, 将液氮缓慢倒入漏斗中。(少量液氮通常会从漏斗中溢出。这不会损害您的仪器。) 然后注入和完全排干液氮并重复两到三遍。等到蒸汽羽烟消失, 然后重复直到装满杜瓦瓶。继续缓慢注入漏斗, 直到消耗 1.0 升液氮或直到漏斗下出现氮气气泡。此时停止注入。
3. 取出漏斗。
4. 等到蒸汽羽烟消失, 关闭杜瓦瓶盖前, 等待 5 分钟让垫圈解冻。
5. 等待 20 分钟, 然后重复该程序以确保杜瓦瓶装满。

3.1.2 打开显微镜

在打开显微镜之前, 打开计算机等待 Windows 登录屏幕出现。如果在打开计算机之前打开显微镜, OMNIC Paradigm 软件可能无法与显微镜或摄像机通信。

- 如果发生这种情况, 请关闭显微镜然后重新打开。
- 如果问题仍然存在, 请关闭计算机和显微镜。启动计算机并等待登录屏幕出现。然后打开显微镜。

3.1.3 打开显微镜和光谱仪

打开光谱仪。相关说明, 请参阅光谱仪的用户手册。

3. 操作

要打开显微镜, 请按前面板上的电源按钮。蓝色指示灯在初始化期间闪烁, 并在显微镜准备就绪使用时持续亮起蓝灯。



3.1.4 启动 OMNIC Paradigm 软件

使用 OMNIC Paradigm 软件可控制显微镜和分析样品。

当您首次启动软件并首次打开显微镜电源时, 软件会检查载物台移动的限制, 以确保一切正常运行。

◆ 启动 OMNIC Paradigm 软件并连接到显微镜

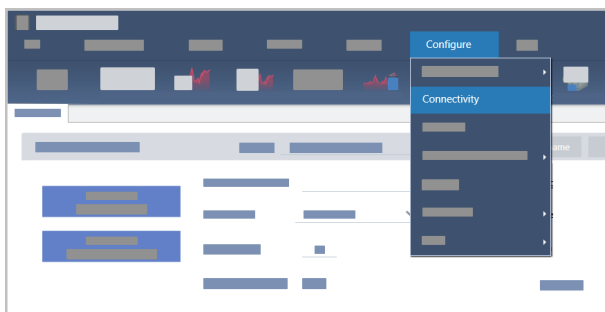
1. 启动 OMNIC Paradigm 软件。
2. 如果软件已连接到显微镜, 仪器状态将显示 Nicolet iS50 RaptIR 和绿色复选标记。



3. 如果软件尚未连接到仪器, 请现在连接。

3. 操作

- a. 进入“**配置 > 连接**”然后选择光谱仪。单击“**连接**”。



- b. 要切换到显微镜视图, 进入“**配置 > 样品位置 > RaptIR™**”。控制面板将更改为显示显微镜工具。要切换回光谱工具, 请将样品位置更改回主光谱仪上的另一个附件或模块。

3.2 分析样品

使用 OMNIC Paradigm 软件可操作显微镜和分析样品。通常,您将按照以下步骤分析样品:

- 准备样品和上样。
- 捕获样品表面的视觉图像。此图像称为拼接图。
- 采集背景光谱。
- 分析样品。

使用 OMNIC Paradigm 软件,您可以设置和使用具有自动化功能的显微镜,以帮助您点亮样品并使其对焦、捕获拼接图和定位背景点,或者您可以手动运行显微镜,无需自动化,并在捕获任何视觉图像或数据之前目视检查您的样品。

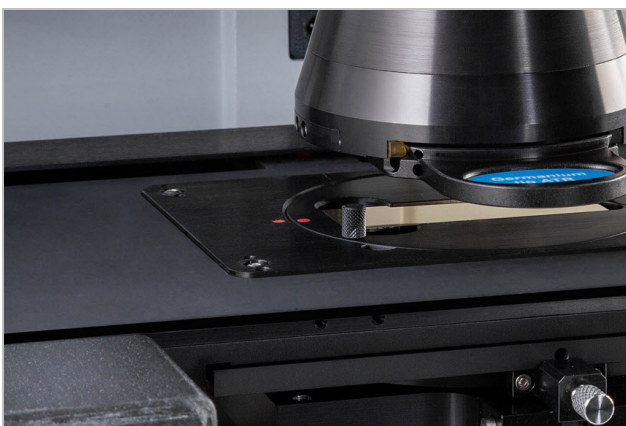
无论哪种情况,第一步都是上样。

3.2.1 上样

弹出载物台,以便更轻松地使用载物台来放置样品。如果样品很小并且很容易到位,则可以在不弹出载物台的情况下放置样品。

◆ 插入样品

1. 在软件中,单击**弹出载物台**。弹出载物台会降低载物台并将其移出,以便更轻松地上样。
2. 插入样品载玻片。载物台适合通用样品架。使用红色指示符正确定位样品架。



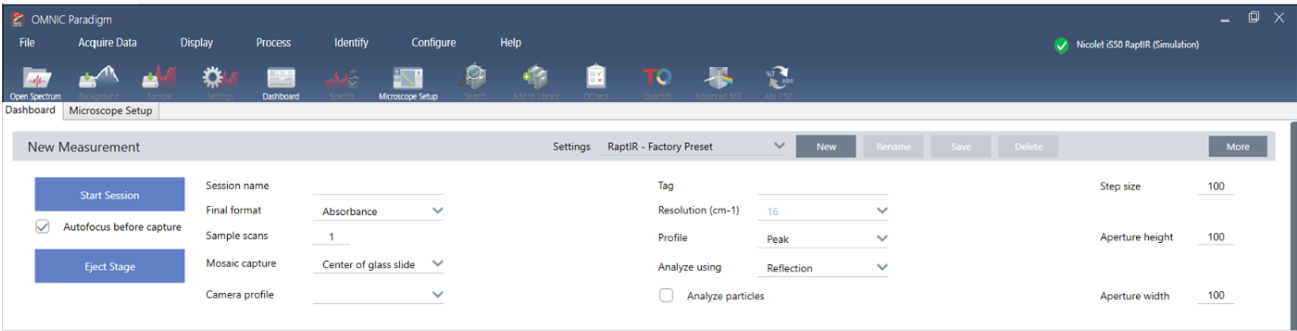
安装样品后,即可开始该工作阶段并采集拼接图。如果弹出载物台,当您开始工作阶段时,载物台将自动移回原位。开始工作阶段之前,您可以离开载物台。

3.2.2 准备测量设置

妥善放置样品后，在控制面板上查看测量设置。最常用的设置显示在顶部，如果单击“更多”按钮，可以查看其他高级设置。

有关每个测量设置的更多信息，请参阅《OMNIC Paradigm 软件用户手册》。

- 要使用自动化功能简化您的显微镜工作阶段，请从拼接图捕获列表中选择一种拼接图类型，然后选择“捕获前自动对焦”。如果您使用 RaptIR 样品架，请在背景设置中选择“使用 RaptIR 样品架上的固定参比位置”。
- 要手动运行工作阶段，请取消选择“捕获前自动对焦”，然后从“拼接图捕获”列表中选择“自定义拼接图”。



Note 选择**颗粒分析**以分析小颗粒组。选择此选项后，颗粒分析工具将出现在工作阶段视图中。取消选择“颗粒分析”可改为分析区域、线和个别采样点。

Note 如果您将 40 倍物镜与手动对焦环一起使用，请确保将对焦环设为 0 位置。错误定位的对焦环可能会干扰自动对焦。

3.2.3 查看您的背景设置

开始工作阶段之前，查看背景采集设置。

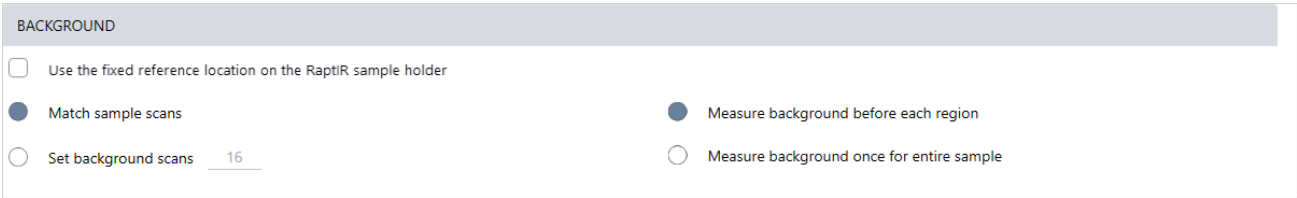


表3-1: 显微镜的背景设置

设置	说明
使用 RaptIR 样品架上的固定参比位置	<p>RaptIR 样品架具有用于透射和反射分析的内置参比点。选择此选项可在捕获初始拼接图后自动将载物台移动到参比位置。</p> <p>如果您在拼接图捕获列表中选择了自定义拼接图, 此选项将不可用。</p> <p>有关详细信息, 请参阅"测量背景 谱图"。</p>
匹配样品扫描	如果选择此项, 用于背景采集的扫描次数将与用于样品测量的扫描次数相同。
设置背景扫描	选择此项可对背景使用与样品不同的扫描次数。
在每个区域之前测量背景	<p>如果选择此项, 软件将在样品的每个新区域之前测量新背景。例如, 如果您的样品测量有三个区域, 选择此选项后, 软件将会在每个区域之前采集一个新背景。</p> <p>请注意, 使用相同测量设置的点集将视为单个区域。</p>
对整个样品测量一次背景	选择此选项后, 将仅在测量设置更改时采集新背景。例如, 若您选择了此选项, 如果您在一次样品采集中测量三个区域并且它们都使用相同的测量设置, 则将仅采集一个背景。

3.2.4 捕获拼接图

妥善放置样品后, 捕获拼接图。拼接图是样品表面的视觉图像。摄像机将捕获一系列高分辨率的小图像并将它们拼接成一个拼接图, 为您提供可用于分析的样品表面大图像。拼接图可作为分析工作区, 用于探索目标区域并指定要进行 IR 数据收集的区域和点。

通常, 当您分析样品时, 您将使用 4 倍或 10 倍放大物镜采集低放大率拼接图像, 根据需要调整设置, 然后如果需要, 可使用 15 倍或 30 倍物镜捕获更小区域的高放大率拼接图像。捕获拼接图后, 绘制区域或选择颗粒, 然后开始测量数据。

捕获拼接图需要查看您的采集设置, 选择捕获拼接图的位置, 然后单击“开始工作阶段”。

◆ 捕获拼接图

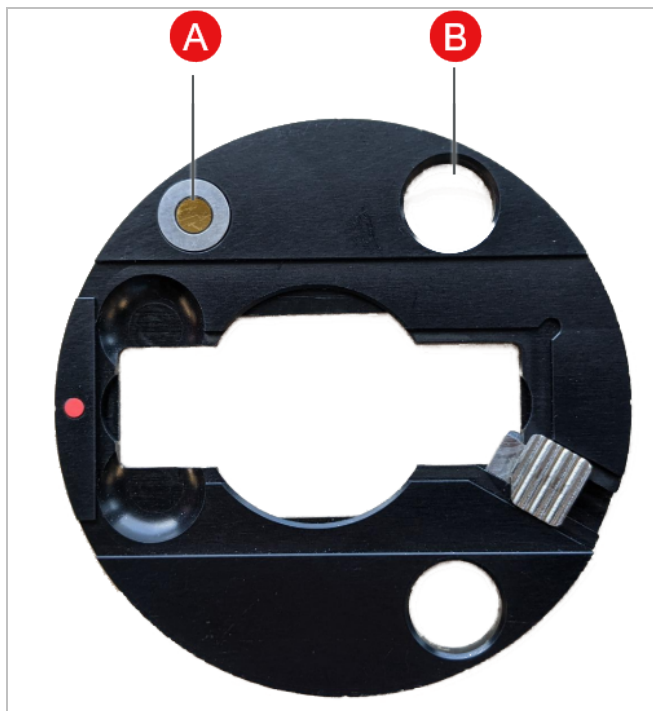
1. 在控制面板上, 选择 **“捕获前自动对焦”** 然后查看您的工作阶段设置。选择此选项后, 软件会自动照明并对焦样品。取消选择该选项可改为手动对焦。
2. 从 **拼接图捕获** 列表中选择 一个位置。此操作将告诉软件在哪里可以找到您的样品以及在哪里捕获拼接图。要在不自动采集拼接图的情况下开始工作阶段, 请选择 **自定义拼接图**。
3. 单击 **“开始工作阶段”**。载物台会将您的样品移到定位并使它对焦, 软件会采集低放大倍率拼接图, 然后将物镜更改为高放大倍率物镜。如果您选择 **使用 RaptIR 样品架上的固定参比位置**, 软件将会捕获高放大倍率快照, 然后载物台会自动移到参比位置以采集背景测量。

如果从“拼接图捕获”列表中选择了“自定义拼接图”, 软件将切换到“工作阶段”视图而不捕获拼接图。

3.2.5 测量背景 谱图

采集样品数据之前，测量背景谱图。

RaptIR 样品架具有用于背景测量的内置参比点。如果您选择使用 RaptIR 样品架上的固定参比位置，载物台将自动移到参比位置并拍摄拼接图快照。然后，您可以如常放置背景点。

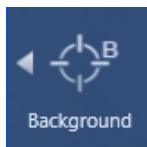


A 用于反射分析的参比点

B 用于透射分析的参比点

◆ 测量背景谱图

1. 在悬浮工具栏中，选择**背景**工具。



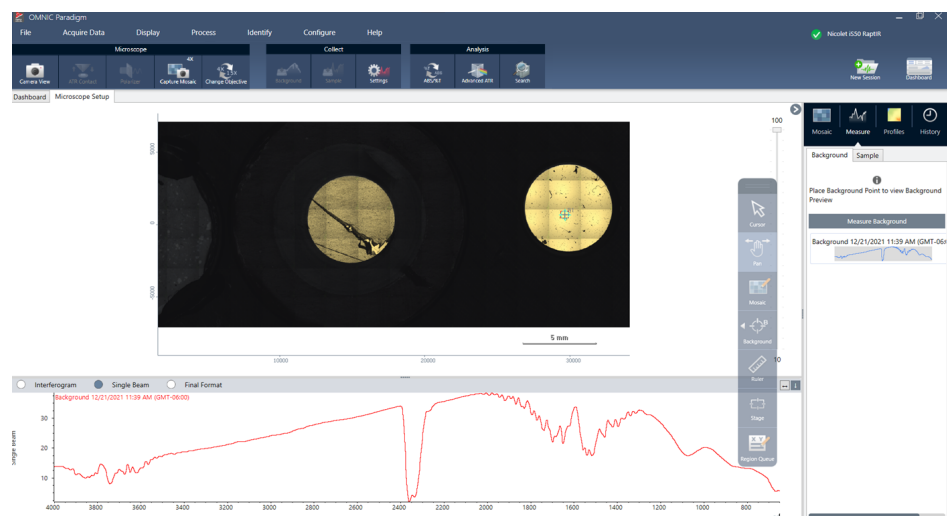
2. 在要测量背景的点单击拼接图。光谱窗格将显示一个实时单光束光谱。使用此光谱可确定是否要将该点用于背景测量。再次单击拼接图移到该背景点。

有关为样品选择最佳背景点的更多信息，请参阅["分析样品"](#)。

3. 对背景点感到满意后，单击**接受背景**。这是在测量数据之前选择更好背景位置的机会。

3. 操作

4. 单击**测量背景**。将采集背景谱图。完成后，该谱图将会添加到”光谱”选项卡的”背景”选项卡中。



如果您在一段时间内测量多个区域，请定期更换背景测量。通常，在测量样品之前，您应该始终对背景进行最近的测量。

3.2.6 分析区域、线和点

通过指定一个或多个要分析的区域来创建样品表面区域的化学图像。您还可以使用点工具在单个点处测量样品，或使用线工具沿线测量。您可以同时测量区域、线和点。

测量区域、点和线需要首先捕获拼接图和测量背景。

◆ 分析区域、线和点

- 1. ["捕获拼接图"](#)
- 2. ["测量背景 谱图"](#).
- 3. 指定要分析的区域、线和点。您可以将多个区域和点添加到单个分析中。

要分析	选择此工具	执行以下步骤
区域		<ul style="list-style-type: none">1. 选择区域工具。2. 单击并拖动拼接图以绘制区域。

<p>线</p> <p>(在 IR 数据采集期间使用偏振器时不可用)</p>		<ol style="list-style-type: none">1. 选择线工具。2. 单击并拖动以绘制线。
<p>点</p>		<ol style="list-style-type: none">1. 选择点工具。2. 单击以添加一个点。

使用光标工具选择或删除区域、线和点。

4. 完成添加区域和点后，单击**样品**。
5. 打开“区域队列”以查看和优化测量中的所有区域、线和点的详细信息。您还可以选择与每个区域关联的背景测量。

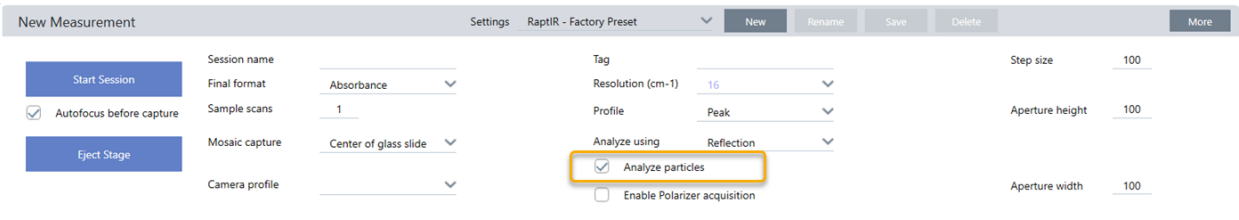
完成测量后，可在新的选项卡中查看结果。有关分析和共享结果的更多信息，请参阅["后续步骤"](#)。

3.2.7 分析颗粒

使用“颗粒分析”工具可定位、表征和识别颗粒。

◆ **分析颗粒**

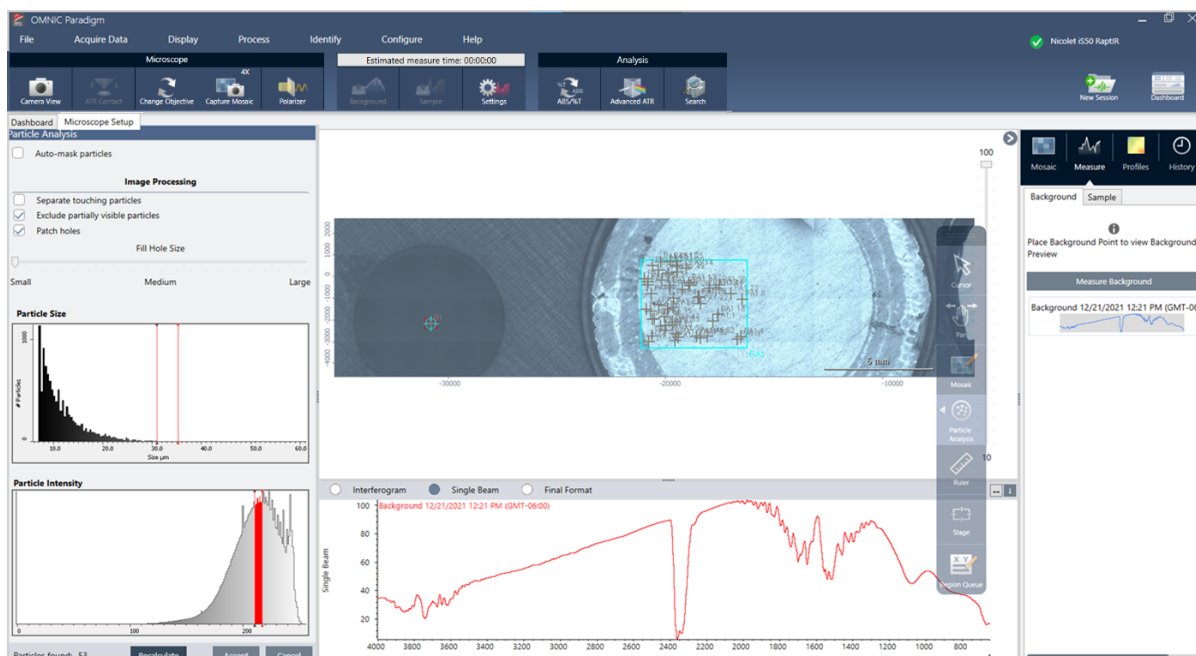
1. 准备样品
2. 在控制面板上，选择**分析颗粒**。



3. ["捕获拼接图"](#)
4. 在工作阶段视图中，查看拼接图并对对焦和照明进行任何必要的更改。如果需要，捕获高放大率拼接图。
5. ["测量背景 谱图"](#)
6. 分析颗粒。

3. 操作

- a. 选择“颗粒分析”工具，然后单击并拖动以在拼接图上绘制一个矩形。这是目标区域，软件将在此处检测颗粒。绘制区域后，将打开“颗粒分析”窗格。



- b. 使用选项和选择工具优化您的选择。更新设置后选择**重新计算**以更新颗粒。有关颗粒分析工具和设置的详细说明，请参阅 **OMNIC Paradigm 指南和教程**。
 - c. 对选择感到满意后，单击**接受**。这将保存选择设置，但尚未测量数据。
 - d. 单击**样品**。
9. 完成测量后，可在新的选项卡中查看结果。有关分析和共享结果的更多信息，请参阅["后续步骤"](#)。

3.2.8 后续步骤

- 应用配置文件以显示样品数据的属性
- 对所选光谱应用处理
- 创建报告或导出数据
- 在光谱视图中进一步探索光谱。

3.3 ATR 测量

使用选配的滑入式衰减全反射 (ATR) 附件, 您可以分析高红外吸收或难以制备的显微材料, 通常只需很少或不需要样品制备。这些材料的例子包括聚合物、涂料、橡胶、涂层纸和生物材料。

ATR 显微镜的应用包括:

- 分析样品的表面
- 分析高吸收材料和厚样品的表面
- 分析表面涂层
- 分析表面缺陷、夹杂物或退化

3.3.1 安装滑入式 ATR 附件

滑入式 ATR 附件适合 15 倍物镜, 并具有两个位置:

- 滑入一半/第一个停止点可看到样品。使用摄像机模式查看样品。
- 全程滑入直到 ATR 的第二个停止点。

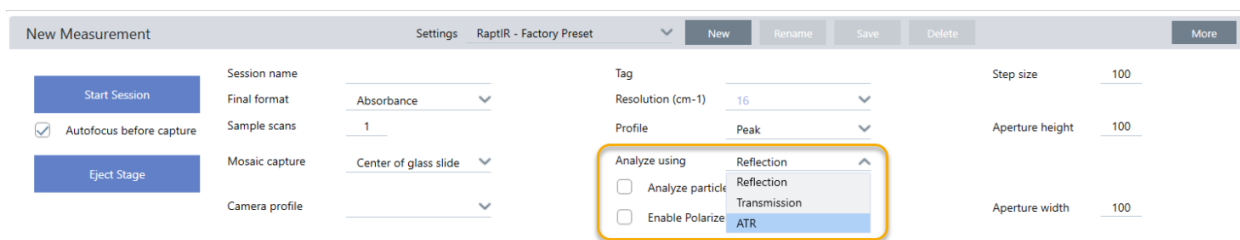
显微镜上的传感器会检测 ATR 附件何时安装, 软件会根据需要提示您安装或删除它。

3.3.2 使用 ATR 测量

要使用 ATR 晶体附件进行测量, 您需要安装晶体附件、准备测量设置并测量样品。

◆ 使用 ATR 测量

1. 在控制面板上, 从“使用以下工具分析:”列表中选择 **ATR**。



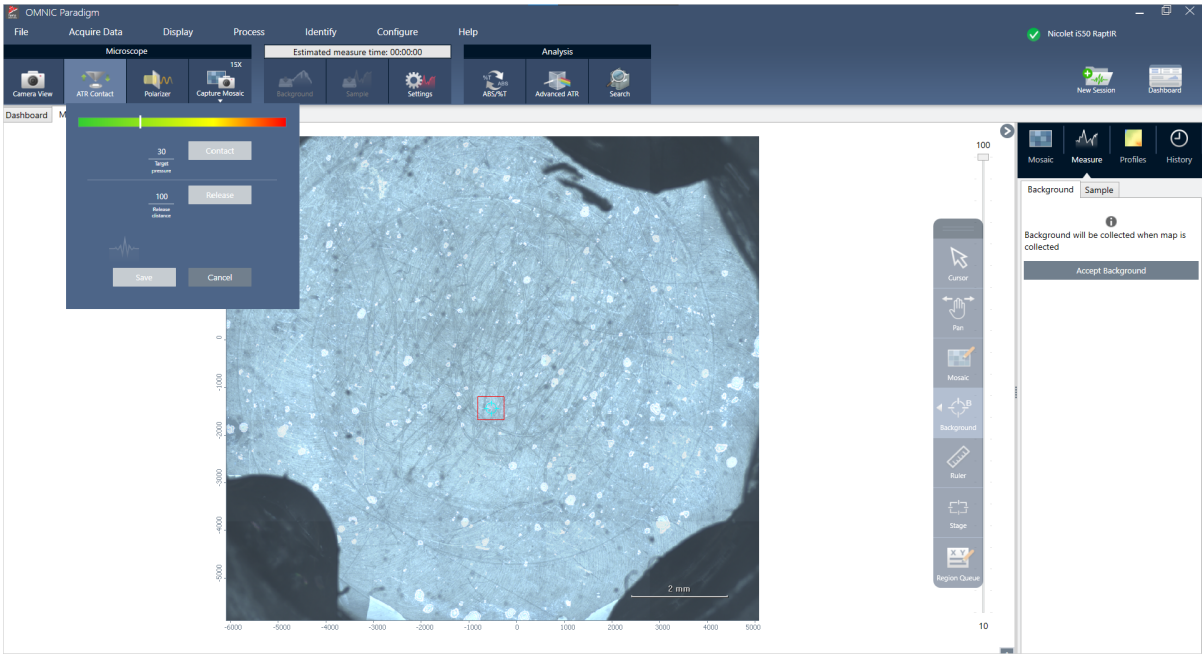
2. ["捕获拼接图"](#)

捕获拼接图后, 您可以在安装晶体的情况下测量背景, 并使用区域或点工具测量您的样品, 就像标准反射测量一样。通常, 默认的“ATR 接触”设置就已足够。但是, 如果要查看或更改接触设置, 可在测量背景或样品之前打开“ATR 接触”视图。

3. 可选: 查看并编辑“ATR 接触”设置。

3. 操作

- a. 在工作阶段视图中, 单击 **ATR 接触** 查看衰减全反射 (ATR) 设置。



设置	说明
目标压力	这是在测量期间将施加的目标压力。单击并拖动滑块或输入一个精确值。
释放距离	释放 ATR 接触后载物台移动的垂直距离。较大的距离可提供更多间隙, 但会导致需要更长的时间来进行 ATR 测量, 因为载物台在每个点都会移动得更远。
按下“接触”测试接触压力	
按下“释放”以释放接触。	

4. [“分析区域、线和点”](#)或[“分析颗粒”](#)。软件会根据需要提示您插入或移除 ATR 晶体附件。

3.4 定位、照亮和遮盖样品

要手动优化您的拼接图像和 IR 数据, 可使用“摄像机视图”来查找目标区域、对焦样品、调整照明和更改光阑。

3.4.1 移动载物台并对焦样品

对焦样品的最简单方法是从“拼接图捕获”列表中选择大致的目标位置, 然后选择“捕获前自动对焦”选项。选择这些选项后, 当您开始工作阶段时, 载物台将自动移到正确位置, 对焦样品, 并捕获拼接图。

如果要移动到另一个位置并对焦新区域, 您可以使用软件或选配的操纵杆移动载物台并使对焦样品。

使用 OMNIC Paradigm 软件或选配的操纵杆移动载物台。切勿尝试用手移动载物台。

使用软件

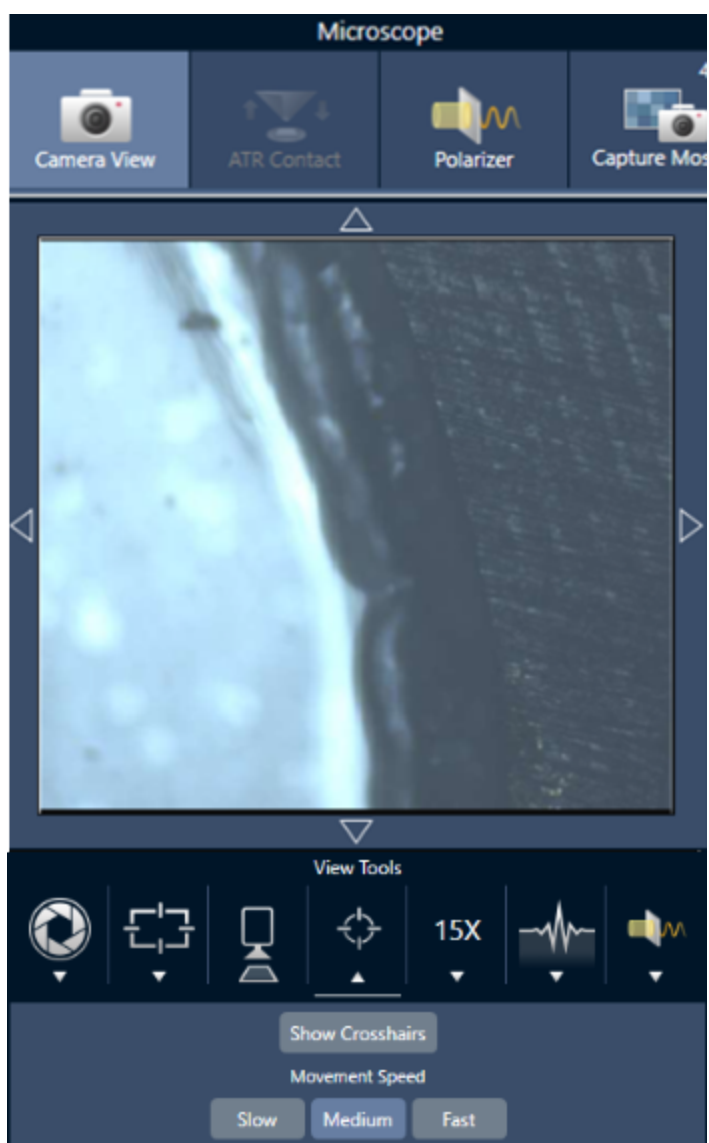
在“工作阶段”视图中, 打开“摄像机视图”查看样品。

- **要水平移动载物台**, 打开“摄像机视图”并打开“载物台”工具。

单击样品图像两侧以及上方和下方的箭头以移动载物台。更改移动速度可更改每次单击时载物台移动的距离。

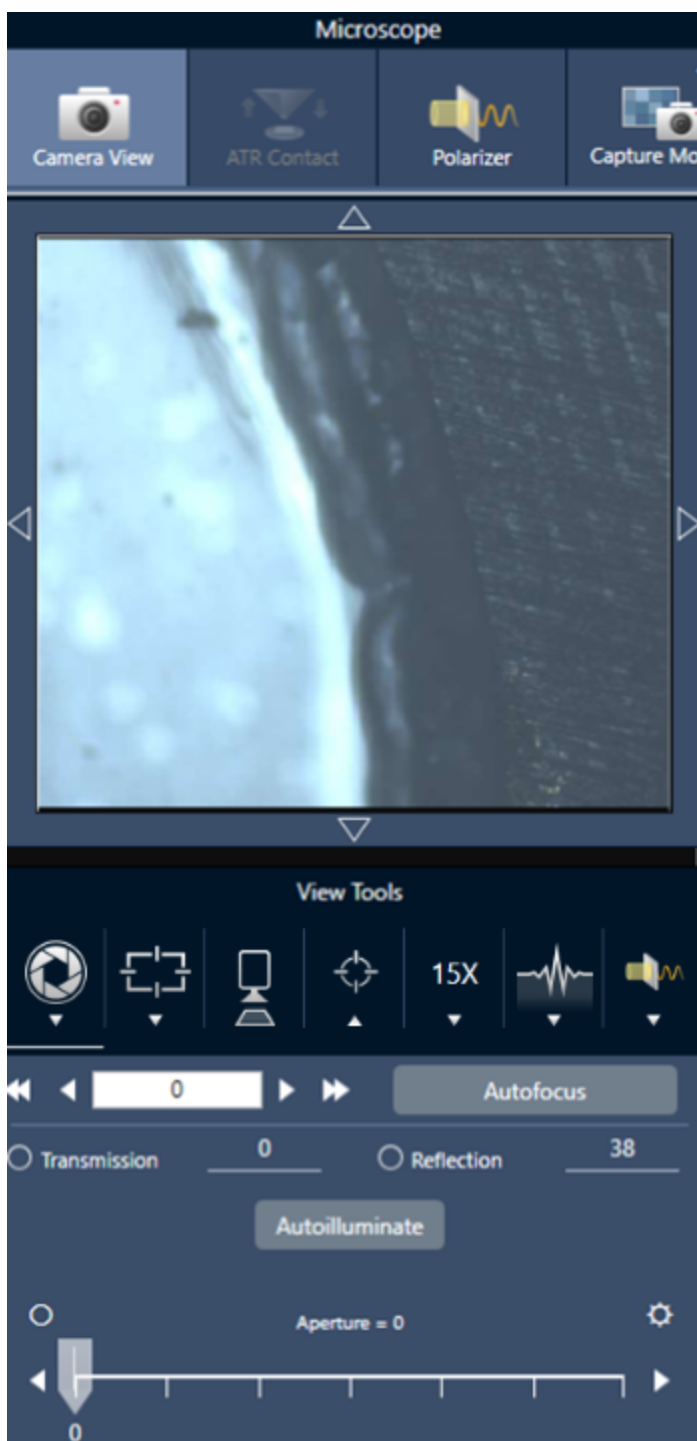
3. 操作

在实时视频图像内双击, 可将载物台居中有在该位置。



3. 操作

- 要向上和向下移动载物台，打开“摄像机视图”并打开对焦设置。单击左箭头和右箭头可上下移动载物台。



自动对焦

要自动对焦样品，请单击“自动对焦”。软件会上下移动载物台以找到最佳焦点。自动对焦最适合视觉对比度高的区域。自动对焦可能难以处理一些低对比度的样品和具有多个焦平面的样品。

自动对焦提示

3. 操作

- 调整照明以获得最佳观看效果。如果照明太高或太低，自动对焦可能没有足够的对比度来找到正确的焦点。
- 如果您将 40 倍物镜与手动对焦环一起使用，请确保将对焦环设为 0 位置。错误定位的对焦环可能会干扰自动对焦。

使用操纵杆

您可以使用操纵杆水平或垂直移动载物台，并且可通过移动速度控制，快速或小心地移动。使用“摄像机视图”或选配的目镜可判断您的位置。

- **要水平移动载物台**，向前、向后、向左和向右推动或拉动操纵杆。
- **要向上或向下移动载物台**，顺时针旋转操纵杆可向上移动载物台，逆时针旋转可向下移动载物台。

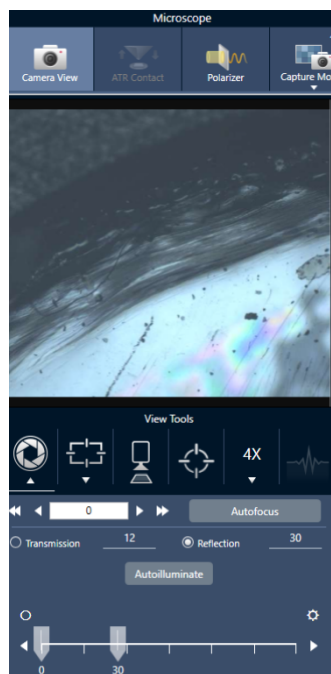
使用速度选择器更改运动速度。

3.4.1 照亮样品

您可以使用软件或选配的操纵杆来控制到达样品的光量。使用反射照明控件设置来自样品上方的光线，使用透射照明控件设置来自样品下方的光线。

使用软件

要在软件中控制照明，请打开“摄像机视图”。选择“透射”或“反射”并将滑块拖动到所需的灯光设置。您也可以输入精确值。



自动照明

单击“自动照明”可以使软件自动优化样品照明。

使用选配的操纵杆

选配的操纵杆具有两个控制旋钮,用于设置透射和反射照明。使用“摄像机视图”或选配的目镜可查看样品照明。旋转旋钮可控制灯光。

3.4.1 调整光阑

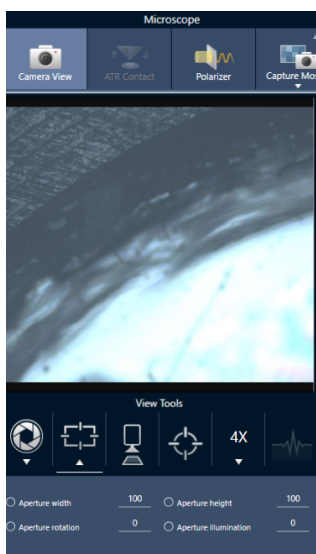
可调光阑定义了红外光束与样品相互作用的区域。这可确保 IR 能量仅照射目标区域而不照射相邻样品材料,并确保通过目标区域边缘的少量衍射辐射不会到达检测器。

在颗粒分析过程中,软件会为所有颗粒找到一组理想的光阑,然后在样品测量期间使用这些光阑。

在控制面板的高级设置区或摄像机视图中手动设置光阑。

◆ 调整光阑的大小、形状和旋转

1. 打开摄像机视图并选择光阑设置。



2. 使用滑块或输入精确值来调整光阑的高度、宽度和旋转。

Note 要显示光阑,请调整照明,直到可以看到明亮的蓝色矩形光穿过光阑。

3.5 验证显微镜性能

通过运行 PV 工作流并检查系统状态，确保您的显微镜运行良好。

3.5.1 性能验证和鉴定工作流

通过运行鉴定或性能验证 (PV) 工作流来检查显微镜的性能。这些工作流使用制定的标准样品来检查仪器的性能。每个测试都遵循不同的监管标准。

PV 和鉴定工作流使用聚苯乙烯标准板来测试显微镜的性能。

表3-1: 鉴定和性能验证工作流说明

测试	说明
Nicolet RaptIR - Factory Qualification	运行工厂推荐的测试和所有鉴定测试。
Nicolet RaptIR - Factory ATR Qualification	使用 ATR 附件运行工厂推荐的测试和所有鉴定测试。
Nicolet RaptIR - PV Test	根据工厂推荐的测试测量 RaptIR 的基本性能。
Nicolet RaptIR - PV ATR Test	使用 ATR, 根据工厂推荐的测试测量 RaptIR 的基本性能。
Nicolet RaptIR - PHEUR Qualification	执行欧洲药典中定义的 RaptIR 鉴定测试。
Nicolet RaptIR - PHEUR ATR Qualification	按照欧洲药典的规定, 对 RaptIR 上的 ATR 附件进行鉴定测试。
Nicolet RaptIR - USP 鉴定	执行美国药典中定义的 RaptIR 鉴定测试。
Nicolet RaptIR - JP Qualification	执行日本药典中定义的 RaptIR 鉴定测试。
Nicolet RaptIR - CP Qualification	执行中国药典中定义的 RaptIR 鉴定测试。

◆ 运行鉴定或性能验证工作流

1. 右击工作流并选择**运行**。
2. 按照屏幕上的提示进行操作。

完成工作流后，最终报告将添加到控制面板的“报告”窗格中并且可以打印。

3.5.2 系统状态

系统状态图标显示有关您的仪器和软件服务的信息。

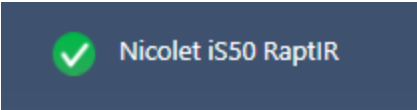




表3-2: 系统状态图标

图标	安装了 Security Suite 的图标	说明
		系统已连接, 所有服务均正常运行。您已准备就绪测量和保存数据。单击系统状态图标可查看有关系统的详细信息。
		<p>黄色图标表示仪器可能存在问题, 例如:</p> <ul style="list-style-type: none">• 检测器变热• 仪器不扫描• 仪器未连接 <p>单击系统状态图标了解有关该问题的更多详细信息。同时目视检查仪器和连接。</p>
		一项或多项软件服务存在问题。单击系统状态图标了解详细信息。如果服务在几分钟后没有自动启动, 请重新启动计算机。

如果您仍然遇到系统状态错误问题, 请联系客户支持。

3.6 使用偏振器

带有偏振器选件的显微镜包括用于可见光和红外光的个别偏振器。

对于每个光源,显微镜都包括两个偏光滤光片,称为偏振器和分析仪。

- **偏振器**:位于光源和样品之间
- **分析仪**:位于样品与摄像机或目镜与检测器之间

使用偏振器时,可以单独插入偏振器,用于平面偏振光,也可以插入偏振器和分析仪,用于交叉偏振光。偏振器和分析仪可以一起旋转,也可以个别旋转。

3.6.1 使用偏振器和分析仪

要使用偏振器,首先要在摄像机视图中查看样品。在这里,您可以使用可见光偏振器并预览光谱数据的偏振器设置。

注:在颗粒分析期间或测量线时不能使用偏振器。它可以用来测量区域和点。

◆ 在摄像机视图中使用偏振器和分析仪

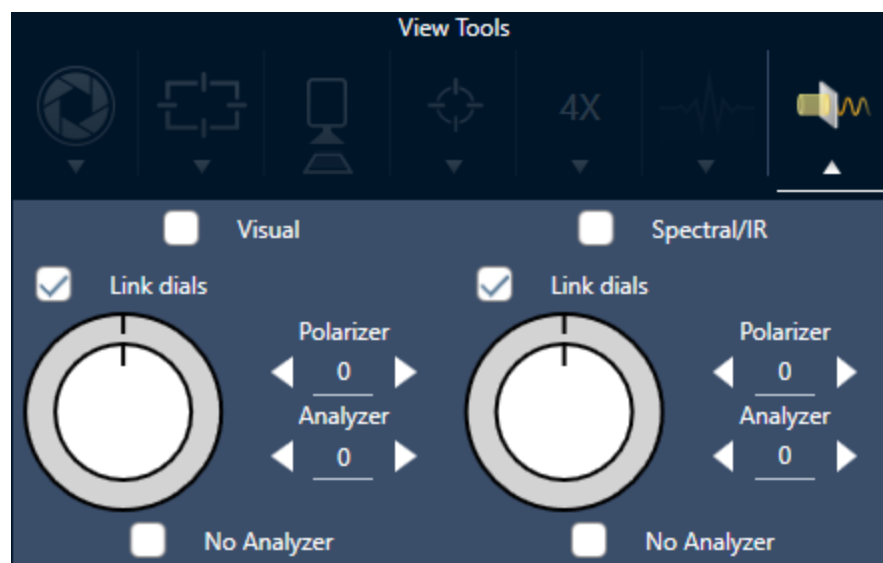
1. 在控制面板上,选择**启用偏振器采集**。

选择此选项后,将使用偏振器来测量区域。如果未更改任何设置,将使用默认的偏振器和分析仪设置。您可以在工作阶段期间改变主意,并在采集数据之前启用或禁用偏振器。

2. 像往常一样开始显微镜工作阶段。

3. 在“显微镜设置”视图中,打开“摄像机视图”并进入“偏振器”选项卡。

图3-1:“摄像机视图”中的“偏振器”选项卡



3. 操作

4. 选择**视觉**可使用可见光偏振器。选择**光谱/IR**可使用 IR 偏振器。
- 在调整可见光偏振器设置时，在“摄像机视图”中查看样品图像。
 - 要预览 IR 偏振器设置，请打开“实时光谱”视图并查看光谱。

在“摄像机视图”中预览偏振图像和 IR 数据

表 1:“摄像机视图”中的“偏振器”设置

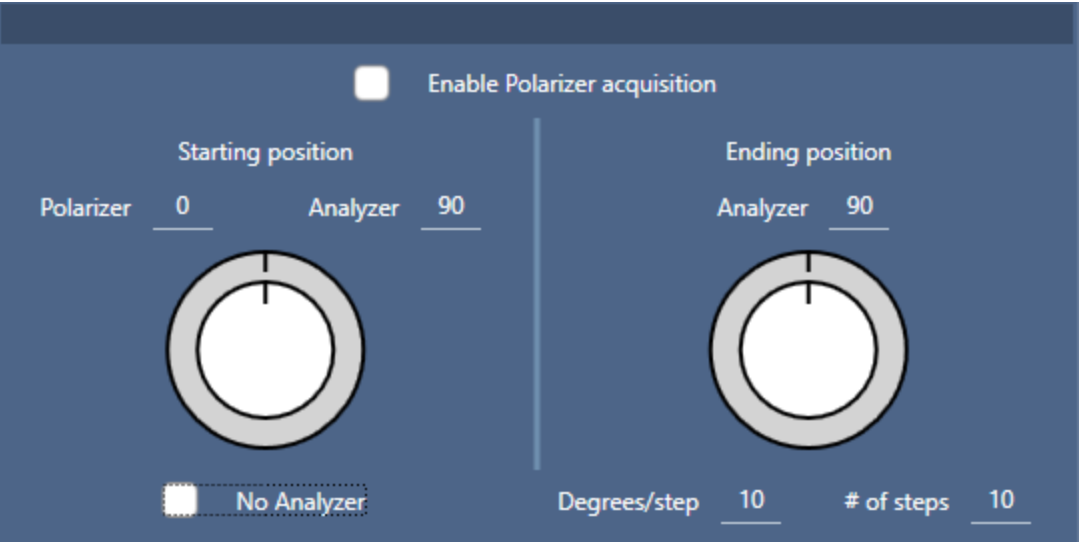
设置	说明
视觉	选择此设置可启用可见光偏振器。
光谱/IR	选择此设置可启用 IR 偏振器。
联结转盘	如果选择此设置，能够以相同的速率旋转偏振器和分析仪。改变其中一个的角度也会改变另一个的角度。
偏振器角度	设置偏振器的角度。
分析仪角度	设置分析仪的角度。
无分析仪	如果选择此设置，将从光束路径中移除分析仪，并且仅使用偏振器。

3.6.2 使用偏振器采集红外数据

在启用偏振器的情况下测量样品时，可以通过两种方式进行测量：

- 使用偏振器(和分析仪，可选)在单个固定角度测量整个区域。
- 在测量过程中自动旋转分析仪，并以指定的间隔采集数据，例如每旋转 5 度。

图3-2: “偏振器设置”选项



◆ 使用偏振器和分析仪采集数据

- 1. 在“显微镜设置”视图中, 单击工具栏中的“偏振器设置”查看偏振器设置。
- 2. 选择**启用偏振器采集**。
- 3. 编辑并查看您的偏振器设置。
 - 要使用单个固定角度, 请将“步数”设为 **1**。仅使用分析仪的起始位置。
 - 对于阶梯式采集, ...
 - a. 设置偏振器的角度。
 - b. 设置分析仪的起始和结束角度。
 - c. 设置**步数**或**度/步**。另一个设置将自动更新。
- 5. 定义一个或多个区域并像往常一样测量样品。

在每个分析仪角度自动测量背景点, 以与样品相对应。采集样品过程中, 在每个指定角度测量每个区域。

表 2: 偏振器采集设置

设置	说明
启用偏振器采集	选择此设置可在数据采集中使用偏振器(以及选择使用分析仪)。
起始位置	
偏振器	偏振器的固定角度
分析仪	分析仪的起始角度。如果将步数设为 1 , 这是唯一使用的角度。

设置	说明
无分析仪	选择此设置可从光束路径中移除分析仪, 并且仅使用偏振器。
结束位置	
分析仪	分析仪结束角度。
度/步 (每步的度数)	输入度数/步数或步数。另一个值将自动计算。
步数	输入度数/步数或步数。另一个值将自动计算。

3.6.3 探索偏振数据

使用偏振器采集数据后, 结果将显示在“分析”选项卡中。查看使用偏振器采集的数据时, 可以使用角度滑块查看在采集中所使用每个角度的轮廓图像。

4. 维护

4.1 清洁显微镜

如果要清除镜子、窗户或光学组件上的灰尘,请使用显微镜随附的吹尘器将其吹掉。不要使用罐装空气或除尘器,否则可能会损坏仪器。切勿让任何液体接触窗口或光学组件。

4.2 维护液氮杜瓦瓶

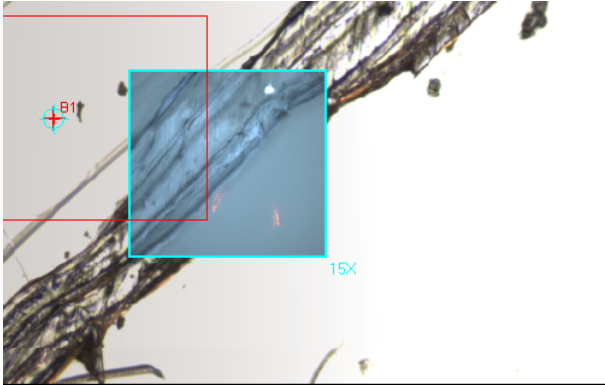
应保持 MCT 检测器杜瓦瓶的绝缘真空数年。如果真空泄漏, 绝缘将失去效力, 并可能出现以下症状:

- 液氮的蒸发速度比平时快很多
- 检测器窗口上冷凝的水和大气污染物将在光谱中显示为不需要的峰

注意

如果您的仪器显示任何这些症状, 则检测器杜瓦瓶可能存在真空泄漏。立即联系我们寻求帮助。

5. 故障排除

问题	可能原因	解决方案
<p>15x 拼接图无法与 4x 倍图像重复对齐。例如，在下图中，15x 图像未与 4x 图像对齐。</p> 	物镜松动	<p>物镜有时会变得松动。这通常在插入和卸下 ATR 附件时发生。</p> <p>如果感觉物镜松动，请用手拧紧物镜。ATR 附件的插槽应直接面向前方。</p> <p>不要过度拧紧物镜，也不要使用 ATR 附件作为杠杆来拧紧物镜。过度拧紧物镜会损坏物镜。</p> <p>如果感觉物镜牢牢固定，但您仍然有对齐问题，请联系您的服务代表。</p>

问题	可能原因	解决方案
<p>软件界面的某些部分不适合屏幕。</p>	<p>您的显示缩放设置与软件不兼容</p>	<p>如果软件界面的某些部分不适合屏幕，您可能需要在设备的显示设置中调整显示缩放。例如，在某些显示器上，如果显示缩放设为 100% 以上，则摄像机工具可能无法适应屏幕。</p> <p>如需更改显示设置的帮助，请参阅 Windows 帮助信息。</p>
<p>拼接图或摄像机视图是完全黑色的。</p>	<p>摄像机未连接。</p>	<p>确认摄像机电缆已插入物镜转换器。</p> <p>确认显微镜 USB 电缆已插入 USB 3.0 连接器。</p>
<p>系统状态显示黄色或红色图标。</p>	<p>仪器或软件服务可能存在问题。</p>	<p>详细信息，请参阅"系统状态"。</p>

6. 联系我们

如需技术支持, 请联系: www.thermofisher.com

6.1 订购部件

如需订购部件, 请联系我们。

如果需要将仪器或附件送修, 请先致电或发邮件联系我们, 了解运送要求或其他说明。